

наличием примесей и включений, т. е. в конечном счёте условиями роста кристаллов.

Наиболее распространённая гипотеза генезиса природных алмазов утверждает их глубинное (магматич.) происхождение при давлениях св. 4 ГПа и темп-рах более 1000°C. Однако включения кальцита, кварца, барита, биотита, обнаруженные в А., ставят под сомнение единственность этой гипотезы.

Теоретич. предпосылки получения А. искусств. путём были научно обоснованы в кон. 30-х гг. 20 в. Синтетич. А. впервые воспроизведено получен в Швеции

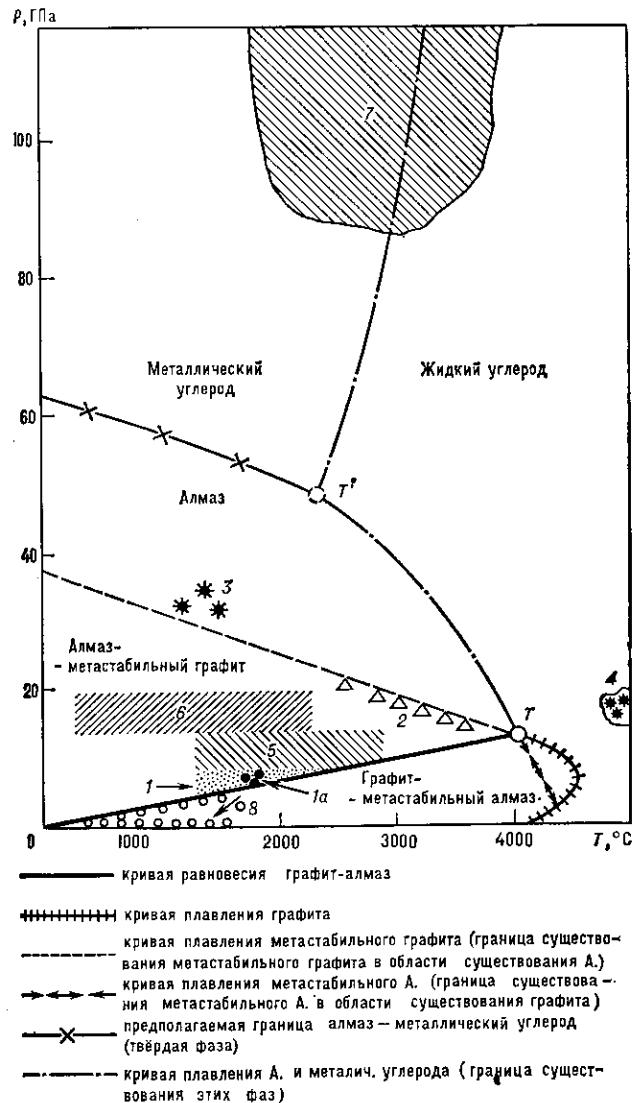


Рис. 2. Фазовая  $p - T$ -диаграмма углерода: 1 — область синтеза алмаза с применением металлов — растворителей-катализаторов ( $1a$  — область выращивания крупных кристаллов на затравку); 2 — область экспериментальных работ по превращению графита в алмаз статическим методом при прямом переходе; 3, 7 — области экспериментальных работ по превращению графита в алмаз динамическим методом (7 — метод фирмы «Дюпон»); 4 — область экспериментальных работ по кристаллизации алмаза из расплавленного углерода; 5 — область изучения некатализитического превращения в алмаз элементарного углерода, находящегося в различных состояниях, и органических соединений; 6 — область образования лосдейлита; 8 — область кристаллизации алмаза в метастабильных условиях.  $T'$  — тройная точка графит — алмаз — жидкий углерод;  $T''$  — предполагаемая тройная точка жидкого углерода — алмаз — металлический углерод.

Точки на диаграмме состояния отвечают тем температурам и давлениям, от которых производится сброс температуры (накалка образцов) для сохранения образованной фазы.

(1953), затем в США (1954) и СССР (1959). Наиболее распространён метод синтеза А. из графита при статич. давлениях высоких. Синтез происходит в области термодинамич. устойчивости А., т.е. при давлениях 4—10 ГПа и темп-рах 1000—2500°C, в присутствии металлов, выполняющих роль растворителей-катализаторов, в течение времени от 10—15 с до 1 ч (размеры получаемых монокристаллов от 0,1 до 1,5 мм по ребру октаэдра; более крупные А.—8—10 мм — выращиваются на затравку св. 100 ч). По истечении времени синтеза для предотвращения обратного перехода А. в графит темп-рую резко снижают, и новая фаза фиксируется. Синтетич. А. образуются также при действии динамич. высокого давления ок. 30 ГПа и темп-ры ~3000°C и выше (размеры получаемых этим методом А.—10—30 мкм). В метастабильных для А. условиях при давлениях от неск. сотен ГПа до неск. Па и темп-рах 600—800°C синтез ведут из газовой фазы (метан, пропан, двуокись углерода и т. п.), как правило на затравку (эпитаксиальное парашивание). При статич. давлении более 11—13 ГПа и темп-ре выше 2500°C возможно превращение графит — алмаз без введение активирующих добавок, а также получение А. из расплава углерода (рис. 2). Синтетич. А. выпускают в виде микропорошков, монокристаллов, поликристаллич. структур (баллас, карбонадо), алмазных спеков и пластин с металлич. подложкой.

Первая классификация А., в основу к-рой положено содержание в нём азота, была предложена в кон. 30-х гг. и уточнена в кон. 50-х гг. В соответствии с этой классификацией большинство А. (~98%) относится к типу I — содержание азота до 0,2%. К типу II принадлежат А., содержащие не более  $10^{-3}$ % азота. А. I и II типов подразделяются на подгруппы. А. подгруппы Ia содержат азот в ионарном виде, А.-дефекты и др. азотсодержащие дефекты сложного строения. А. подгруппы Ib содержат одиночные замещающие атомы азота. А. подгруппы Ia прозрачны до длин волн  $\lambda \sim 320$ —330 мкм, Ib — в области  $\lambda > 500$ —550 мкм и имеют максимум поглощения при  $\lambda = 270$  мкм. А. II типа также делятся на две подгруппы: IIa (безазотные А.) и IIb (А., содержащие примеси, ответственные за полупроводниковые свойства, в частности В). Выделяют также А. типа III, к к-рому относят А., характеризующиеся наличием  $B_1$ -дефектов. А. этого типа лог-щают излучение в области  $\lambda \sim 225$ —240 мкм. А. I и III типов характеризует поглощение ИК-излучения в области  $\lambda \sim 7$ —11 мкм.

Физ. свойства А. связаны с его структурой и содержанием примесей, кол-во к-рых в природных А. достигает 5%, в синтетических 8—10%. В качестве структурных примесей достоверно зафиксированы N, B, Ni. В процессе синтеза можно легировать А. путём введения в шихту разл. добавок. Спайность граней А. по (111) совершенная. Критич. напряжение скальвания по (111) —  $10,5 \pm 0,1$  ГПа, по (100) —  $13,5 \pm 0,1$  ГПа. Предел прочности на сжатие кристаллов синтетич. А. без видимых включений 17—17,5 ГПа. А. имеет максимальную среди всех известных материалов твёрдость, к-рая превышает твёрдость корунда в 150 раз. Кристалл А. анизотропен, для разных граней его твёрдость различна (для грани (111) природного А.—110—135 ГПа, для (100)—56—60 ГПа; для грани (111) синтетического А.—91—101 ГПа, для (100)—60—68 ГПа).

Кристалл А., имеющий мин. кол-во примесей (А. «чистой воды»), прозрачен для излучения в видимой части спектра и встречается редко. Чаще всего А. окрашены в разл. цвета — от жёлтого до серого и чёрного. Синтетич. А. обычно зёлёные. Введение примесей в исходную шихту позволяет изменять цвет синтетич. А.

Теплопроводность нек-рых А. при комнатной темп-ре выше теплопроводности меди в  $1/4$  раза; ср. её значения при 180°C (Вт/м·К) для А. типа Ia—800, для IIa—